
**Surface chemical analysis —
Secondary ion mass spectrometry
— Method for determining yield
volume in argon cluster sputter depth
profiling of organic materials**

Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions secondaires — Méthode de détermination du rendement volumique dans le cadre du profilage en profondeur de matériaux organiques par pulvérisation d'argon en grappe



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn